

中 国 国 家 标 准 汇 编

74

GB 6588 ~ 6663

中 国 标 准 出 版 社

1 9 9 0

中 国 国 家 标 准 汇 编

74

GB 6588~6663

中国标准出版社总编室 编

*

中国标准出版社出版

(北京复外三里河)

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

版 权 专 有 不 得 翻 印

*

开本 880×1230 1/16 印张 52.5 字数 1 480 000

1991年8月第一版 1991年8月第一次印刷

印数 1— 9 000 [精] 定价 30.70 元 [精]
2 800 [平] 26.00 元 [平]

*

ISBN 7-5066-0362-4/TB·146 [精]

ISBN 7-5066-0363-2/TB·147 [平]

*

标 号 163-08 [精]
163-07 [平]

出 版 说 明

《中国国家标准汇编》是一部大型综合性工具书，自1983年起，以精装本、平装本两种装帧形式，分若干分册陆续出版。本汇编在一定程度上反映了我国建国以来标准化事业发展的基本情况和主要成就，是各级标准化管理机构及工矿企事业单位，农林牧副渔系统，科研、设计、教学等部门必不可少的工具书。

本汇编收入公开发行的全部现行国家标准，按国家标准号顺序编排。凡遇到顺序号短缺，除特殊注明外，均为作废标准号或空号。

本分册为第74分册，收入了国家标准GB 6588～6663的最新版本。由于标准不断修订，读者在使用和保存本汇编时，请注意各标准末页是否有勘误表或修改通知单，并及时更换修订过的标准。

中国标准出版社除出版《中国国家标准汇编》外，还出版国家标准、行业标准的单行本及各种专业标准汇编，以满足不同读者的需要。

中国标准出版社

1990年10月

目 录

GB 6588—86 通用信号和(或)开关半导体二极管空白详细规范	(1)
GB 6589—86 电压调整和电压基准二极管(包括温度补偿精密基准二极管)空白详细规范	(16)
GB 6590—86 100A以下环境和管壳额定的双向三极晶体闸流管空白详细规范	(25)
GB 6591—86 电子设备用电器和电阻器名词术语	(36)
GB 6592—86 电子测量仪器误差的一般规定	(104)
GB 6593—86 电子测量仪器质量检验规则	(113)
GB 6594—86 聚苯乙烯模塑和挤出料命名	(120)
GB 6595—86 聚丙烯树脂“鱼眼”测试方法	(123)
GB 6596—86 膜渗透压法测定聚苯乙烯标准样品的数均分子量	(126)
GB 6597—86 蒸气压渗透法测定聚苯乙烯标准样品的数均分子量	(136)
GB 6598—86 小角激光光散射法测定聚苯乙烯标准样品的重均分子量	(140)
GB 6599—86 体积排斥色谱法测定聚苯乙烯标准样品的平均分子量及分子量分布	(146)
GB 6600—86 工业用裂解碳四的组成测定 气相色谱法	(153)
GB 6601—86 工业用裂解碳四 液态采样法	(162)
GB 6602—89 液化石油气蒸气压测定法(LPG法)	(166)
GB 6603—86 工业用裂解碳四密度或相对密度的测定 压力浮计法	(173)
GB 6604—86 工业用裂解碳四中微量硫的测定 氧化微库仑法	(177)
GB 6605—86 工业用裂解碳四中微量水的测定 卡尔·费休法	(182)
GB 6606—86 工业用裂解碳四中 α -炔烃含量的测定 硝酸银法	(193)
GB 6607—86 钨	(197)
GB 6608—86 铝箔厚度的测定 称量法	(199)
GB 6609.1—86 氧化铝化学分析方法 重量法测定水分	(201)
GB 6609.2—86 氧化铝化学分析方法 重量法测定灼烧失量	(203)
GB 6609.3—86 氧化铝化学分析方法 钼蓝光度法测定二氧化硅量	(205)
GB 6609.4—86 氧化铝化学分析方法 邻二氮杂菲光度法测定氧化铁量	(208)
GB 6609.5—86 氧化铝化学分析方法 火焰光度法测定氧化钠量	(211)
GB 6609.6—86 氧化铝化学分析方法 火焰光度法测定氧化钾量	(216)
GB 6609.7—86 氧化铝化学分析方法 三辛基氧化膦-硫氰酸盐光度法测定二氧化钛量	(219)
GB 6609.8—86 氧化铝化学分析方法 二苯基碳酰二肼光度法测定三氧化二铬量	(223)
GB 6609.9—86 氧化铝化学分析方法 二乙基二硫代氨基甲酸铅光度法测定氧化铜量	(227)
GB 6609.10—86 氧化铝化学分析方法 苯甲酰苯基羟胺萃取光度法测定五氧化二钒量	(231)
GB 6609.11—86 氧化铝化学分析方法 原子吸收分光光度法测定一氧化锰量	(234)
GB 6609.12—86 氧化铝化学分析方法 原子吸收分光光度法测定氧化锌量	(239)
GB 6609.13—86 氧化铝化学分析方法 原子吸收分光光度法测定氧化钙量	(244)
GB 6609.14—86 氧化铝化学分析方法 钨-茜素络合酮光度法测定氟量	(249)
GB 6609.15—86 氧化铝化学分析方法 硫氰酸铁光度法测定氯量	(254)
GB 6609.16—86 氧化铝化学分析方法 姜黄素光度法测定三氧化二硼量	(259)
GB 6609.17—86 氧化铝化学分析方法 钼蓝光度法测定五氧化二磷量	(263)

GB 6609.18—86 氧化铝化学分析方法 N,N-二甲基对苯二胺光度法测定硫酸根量	(266)
GB 6610.1—86 氢氧化铝化学分析方法 重量法测定水分	(272)
GB 6610.2—86 氢氧化铝化学分析方法 重量法测定灼烧失量	(274)
GB 6610.3—86 氢氧化铝化学分析方法 钼蓝光度法测定二氧化硅量	(276)
GB 6610.4—86 氢氧化铝化学分析方法 邻二氮杂菲光度法测定氧化铁量	(279)
GB 6610.5—86 氢氧化铝化学分析方法 火焰光度法测定氧化钠量	(282)
GB 6611—86 钛及钛合金术语	(287)
GB 6612—86 重要用途的TA7钛合金板材	(292)
GB 6613—86 重要用途的TC4钛合金板材	(296)
GB 6614—86 钛及钛合金铸件	(301)
GB 6615—86 硅片电阻率的直排四探针测试方法	(305)
GB 6616—86 硅片电阻率的非接触式测试方法	(320)
GB 6617—86 硅片电阻率的扩展电阻探针测试方法	(324)
GB 6618—86 硅片厚度和总厚度变化的测试方法	(329)
GB 6619—86 硅片弯曲度的接触式测试方法	(332)
GB 6620—86 硅片翘曲度的非接触式测试方法	(334)
GB 6621—86 硅抛光片表面平整度的非接触式测试方法	(340)
GB 6622—86 硅化学抛光片漩涡缺陷和条纹的测试方法	(346)
GB 6623—86 硅抛光片表面热氧化层错的测试方法	(350)
GB 6624—86 硅抛光片表面质量目测检验方法	(354)
GB 6625—86 掺氮吸气剂含氮量测试方法	(357)
GB 6626.1—86 释汞吸气剂性能测试方法 释汞吸气剂释汞特性的测试方法	(362)
GB 6626.2—86 释汞吸气剂性能测试方法 释汞吸气剂含汞量的测试方法	(368)
GB 6626.3—86 释汞吸气剂性能测试方法 释汞吸气剂放气量的测试方法	(370)
GB 6626.4—86 释汞吸气剂性能测试方法 释汞吸气剂压粉牢固度的检测方法	(374)
GB 6627—86 人造石英晶体棒材型号命名方法	(378)
GB 6628—86 人造石英晶体棒材	(379)
GB 6629—86 盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头	(383)
GB 6630—86 调味马面鲀鱼干	(388)
GB 6631—86 烤鱼片	(396)
GB 6632—86 鲜青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼	(404)
GB 6633—86 有囊围网网具图的绘制	(407)
GB 6634—86 渔船捕捞机械设备图形符号	(414)
GB 6635—86 渔具基本名词术语	(423)
GB 6636—86 渔具制图	(437)
GB 6637—86 渔网网片缩结	(461)
GB 6638—86 渔网网片剪裁和计算	(463)
GB 6639—86 渔网网片缝合与装配	(468)
GB 6640—86 鲜蓝圆鲹	(480)
GB 6641—86 虾米(海产)	(484)
GB 6642—86 虾皮	(487)
GB 6643—86 通用硬同轴传输线及其法兰连接器总规范	(490)
GB 6644—86 通用硬同轴传输线及其法兰连接器详细规范	(499)
GB 6645—86 用于水泥中的粒化电炉磷渣	(512)

GB 6646.1—86	温石棉纤维干式分级方法.....	(520)
GB 6646.2—86	温石棉纤维长度湿式分级方法.....	(522)
GB 6646.3—86	温石棉纤维长度快速湿式分级方法.....	(525)
GB 6646.4—86	温石棉比表面积测定方法.....	(528)
GB 6646.5—86	温石棉中砂粒与未解离石棉含量测定方法.....	(533)
GB 6646.6—86	温石棉水分测定方法.....	(536)
GB 6647—86	半导体集成电路 4位微型机电路系列和品种.....	(538)
GB 6648—86	半导体集成电路静态读 /写存储器空白详细规范.....	(585)
GB 6649—86	半导体集成电路外壳总规范.....	(596)
GB 6650—86	计算机机房用活动地板技术条件.....	(620)
GB 6651—86	十二片可换磁盘组 (200兆字节)	(628)
GB 6652—86	十二片可换磁盘组 (100兆字节)	(672)
GB 6653—86	焊接气瓶用钢板.....	(716)
GB 6654—86	压力容器用碳素钢和低合金钢厚钢板.....	(720)
GB 6655—86	多层压力容器用低合金钢板.....	(726)
GB 6656—86	铁氧体永磁直流电动机.....	(731)
GB 6657—86	助听器电声特性的测量方法.....	(752)
GB 6658—86	具有感应拾音线圈输入的助听器电声特性的测量方法.....	(769)
GB 6659—86	具有自动增益控制电路的助听器电声特性的测量方法.....	(772)
GB 6660—86	助听器及其有关设备的符号与标记.....	(777)
GB 6661—86	插入式耳机的乳头状接头.....	(786)
GB 6662—86	地面无线电接力系统所用设备的测量方法 第一部分：分系统和仿真系统 通用的测量 第三节 中频范围的测量.....	(789)
GB 6663—86	直热式负温度系数热敏电阻器总规范.....	(807)

中华人民共和国国家标准

通用信号和（或）开关 半 导 体 二 极 管 空 白 详 细 规 范

UDC 621.385.2

GB 6588—86

Blank detail specification for general
purpose signal and/or switching
semiconductor diodes

（可供认证用）

本空白详细规范规定了制订通用信号和（或）开关半导体二极管详细规范的基本原则，制订该范围内的所有详细规范应与本空白详细规范一致。

本空白规范是与GB 4936.1—85《半导体分立器件总规范》有关的一系列空白规范中的一个。

要求资料

下列所要求的各项内容，应列入规定的相应空栏中。

详细规范的识别

- (1) 授权发布详细规范的国家标准化机构名称。
- (2) IECQ 详细规范号。
- (3) 总规范号和年代号。
- (4) 详细规范号、发布日期和国家体系要求的任何更多的资料。

器件的识别

- (5) 器件类型的简略说明。
- (6) 典型结构和应用资料。
- (7) 外形图和（或）引用有关的外形标准。
- (8) 质量评定的类别。
- (9) 能在器件型号之间比较的最重要特性的参考数据。

(1)	(2)
评定器件质量的根据: GB 4936.1—85 《半导体分立器件总规范》	详细规范号〔如果详细规范号与IECQ 号重复，则本栏可以不用〕
详细规范： 〔有关器件的型号〕 订货资料：见本规范第7章	(5)
1 机械说明 外形标准：IEC 191—2 《半导体器件机械标准化 第二部分 尺寸》 外形图和连接： [如有与管壳连接的引线则应说明] [可以转到本规范的第10章或给出详图] 标志：字母和图形或色码 [见GB 4936.1的2.5条和（或）本规范第6章] 极性识别：[如采用特殊的方法则应说明]	2 简略说明 信号二极管 开关二极管 可控雪崩二极管 半导体材料：锗/硅…… 封装：金属/玻璃/塑料…… 功率：环境额定(T_{amb}) 或管壳额定(T_{case})
	3 质量评定类别 [根据GB 4936.1的2.6条]
	(8)
	参考数据
	(9)
已按本详细规范鉴定合格的器件的有关资料，见合格产品一览表	

[整个空白规范中，在方括号内给出的内容仅供指导制订详细规范时用，而不包括在详细规范中。]

整个规范中：

X：表示应填入详细规范的数值。

(X)：对应于“适用时”或替换情况下所给出的数值。

4 极限值（绝对最大额定值）

除另有规定，这些极限值在整个工作温度范围内适用。

[只重复使用带有标题的条款号。任何附加数值在适当的地方给出，但没有条款号。]

曲线最好在本规范的第10章下面给出。]

条款号	极限值	符号	数值	
			最小值	最大值
4.1	工作环境温度或管壳温度	$T_{amb}/case$	X	X
4.2	贮存温度	T_{stg}	X	X
4.3	反向电压： 必要时，附上温度降额曲线（见第10条）			
4.3.1	恒定（直流）反向电压	V_R		X
4.3.2	反向峰值电压（如果不同） 在规定的脉冲条件下	V_{RM}		X
4.4	正向电流（适用时）： 在规定的安装条件下			
4.4.1	与温度有关的恒定（直流） 正向电流 (曲线见第10章)	$I_F(T)$		X
4.4.2	正向峰值电流 在规定的工况条件下 (仅用于开关二极管和可控雪崩二极管)	I_{FRM}		X
4.5	功率耗散（适用时）： (应规定通风条件和(或)安装的特殊要求)	I_{FSM}		X
4.5.1	或与温度有关的最大功率耗散 (曲线见第10条)	$P_{tot}(T)$		X
4.5.2	或最高有效（等效）结温 和功率耗散的绝对极限值	$T_{(v)}$ P_{tot}		X
4.6	反向重复峰值功率和(或)反向不重复峰值功率 反向重复峰值能量和(或)反向不重复峰值能量 (仅用于可控雪崩二极管) (应规定条件，例如时间、频率)	$P_{RRM/RSM}$ $W_{RRM/RSM}$		X

5 电特性

检验要求(A组和C组)见本规范的第8章。

在本条和检验节中标明“适用时”的那些特性，或省略，或如果规定则应进行测试。

[只重复使用带有标题的条款号。任何附加特性在适当的地方给出，但没有条款号。]

当在同一详细规范中包括几种规格的器件时，有关的值应以连续方式给出，以避免相同值的重复。

曲线最好在本规范第10章下面给出。]

条款号	特性和条件 除非另有规定, T_{amb} 或 $T_{case} = 25^\circ\text{C}$	符号	数 值		试验分组
			最小值	最大值	
5.1	反向电流 在最大恒定反向电压 $V_{R_{max}}$ 下	I_{R1}		X	A2b
5.2	反向电流 在规定的恒定反向电压 V_{R2} (最好在 $V_{R_{max}}$) 和 高温*下	I_{R2}		X	C2b
5.3	正向电压 在正向大电流 I_{F1} 下 (恒定 (直流) 或脉冲, 按 规定)	V_{F1}		X	A2b
5.4	正向电压 (适用时) 在正向小电流 I_{F2} 下 (恒定 (直流) 或脉冲, 按 规定)	V_{F2}	(X)		C2b
5.5	电容 在规定低电压 V_R 下, 频率最好为 1 MHz	C_{tot}		X	C2a
5.6	反向恢复时间或恢复电荷 在规定条件下 (仅用于开关二极管)	t_{rr}/Q_s		X	A3
5.7	正向恢复时间 (适用时) 在规定的条件下 (仅用于开关二极管和可控雪崩二极管)	t_{fr}		(X)	A3
5.8	电压检波效率 在规定的条件下 (仅用于作检波用的信号二极管)	η_v	(X)		C2a
5.9	雪崩击穿电压 在规定反向电流 I_R 下 (脉冲, 按规定) (仅适用于可控雪崩二极管)	$V_{(BR)}$	X	X	A2b
5.10	最大热阻 在引用有效结温为额定值时, 给出: 结到环境的热阻最大值 或 结到管壳的热阻最大值 或 结到引线规定点的热阻最大值	R_{th}		(X)	C2d

6 标志

[除了前面 (7) 栏和 (或) GB 4936.1的2.5条所给出的外, 任何其它特殊资料应在这里规
定。]

* 对硅器件至少 100°C , 对锗器件至少 55°C 。

7 订货资料

除非另有规定，订购一种具体器件至少需要以下资料：

准确的型号（如果要求，给出标称电压值）；

当有关时，带版本号和（或）日期的IECQ详细规范标准；

质量评定类别（如果要求，按GB 4936.1的3.6.2款的筛选顺序）；

任何其它的细节。

8 试验条件和检验要求

[在下表中给出试验条件和检验要求，其中所用数值和确切的试验条件，应按照给定型号的要求和按GB 6589—86《电压调整和电压基准二极管（包括温度补偿精密基准二极管）空白详细规范》及GB 4937—85《半导体分立器件机械和气候试验方法》标准有关的要求规定。]

[填写详细规范时，应确定选择哪些替换试验方法。]

[当在同一详细规范中包括几种规格的器件时，有关条件和（或）数值应以连续的方式给出，其中尽可能避免相同条件和（或）数值的重复。]

在本节中除非另有规定，引用的条款号对应于GB 4936.1的条款号，测试方法引自GB 4936.1的6.1.1款。

[抽样要求，按照适用的质量评定类别，参照或重述GB 4936.1的3.6.2款的数值。]

对于A组，在详细规范中选择 AQL 或 LTPD 方案。]

A组——逐批

全部试验都是非破坏性的（3.6.6）。

检验或试验	符 号	引用标准	条 件 除非另有规定， T_{amb} 或 $T_{case} = 25^\circ C$ (见GB 4936.1的第4条)	检 验 要 求	
				极 限	
A1分组 外部目检		5.1.1		最 小 值	最 大 值
A2a分组 不工作器件				$I_F > [10 I_{F1max}]$ 或 $I_R > [100 I_{R1max}]$ [除非另有规定]	
A2b分组 反向电流 正向电压	I_{R1} I_{F1}	D - 002 D - 001	V_R = 最大恒定值 V_{F1} = (恒定(直流)大电流或脉冲*, 按规定)	X	X
击穿电压(仅用于 可控雪崩二极管)	$V_{(BR)}$	D - 009	I_R = 规定值(脉冲*, 按规定)	X	X
A3分组 反向恢复时间 (仅用于开关二极管) 或 恢复电荷 (仅用于开关和可 控雪崩二极管) 正向恢复时间 (适用时)	t_{rr} Q_s t_{fr}	D - 004 D - 003 D - 005	I_F , i_{rr} 和 (V_R, R_L) 或 I_{RM} = 规定值 I_F , 规定反向电路条件 V_R, I_F = 规定值 恢复电荷见 D - 005		X X (X)
A4分组 如果要求则适用					

注：有关A组的最小和最大极限值被认为是B组和C组的LSL和USL(上、下规范极限值)。

* 优选的脉冲条件： $t_p = 300\mu s$, $\delta \leq 2\%$ 。

B组——逐批

对 I 类的要求, 见 GB 4936.1 的 2.6 条。

L_{SL} = 规范的下限 }
U_{SL} = 规范的上限 } 根据 A 组。

只有标明 (D) 的试验是破坏性的 (3.6.6)。

检验或试验	符 号	引用标准	条 件 除非另有规定, T_{amb} 或 $T_{case} = 25^{\circ}\text{C}$ (见 GB 4936.1 的第 4 章)	检验要求		
				极 限	最 小 值	最 大 值
B1分组 尺寸		5.2或附录 C			见本规范第 1 章	
B3分组 引线弯曲 (D) (如果适用)		GB 4937—85 2.1.2	力 = [见 GB 4937—85 的 2.1.2]		无损坏	
B4分组 可焊性		GB 4937—85 2.2.1	〔按规定: 最好用焊槽法〕		润湿良好	
B5分组 温度变化 继之以: 或 交变湿热 (D) (对非空腔器件) 最后测试: 反向电流 正向电压 击穿电压 (仅用于 可控雪崩二极 管) 或 密封 (对空腔器件)	I_{R1} V_{F1} $V_{(BR)}$	GB 4937—85 3.1 GB 2423.4—81	按规定 按规定 按 A 2 分组 按 A 2 分组 按 A 2 分组	LSL	USL USL USL	
B8分组 电耐久性 最后测试: 反向电流 正向电压 击穿电压 (仅用 于可控雪崩二 极管)	I_{R1} V_{F1} $V_{(BR)}$	GB 4938—85	168小时, 高温反偏或工作寿命。 按 A 2 分组 按 A 2 分组 按 A 2 分组	0.95 LSL	2 USL 1.1 USL 1.05 USL	
CRRL 分组	B3, B4, B5 和 B8 的属性资料					

C 组——周期

L S L = 规范下限 } 根据 A 组。
 U S L = 规范上限 }

只有标明 (D) 的试验是破坏性的 (3.6.6)。

检验或试验	符 号	引用标准	条 件		检 验 要 求
			除非另有规定, T_{amb} 或 T_{cas} = 25°C (见 GB 4936.1 的第 4 条)	极 限	
C1 分组 尺寸			最 小 值	最 大 值	
C2a 分组 电容 电压检波效率 (仅用于检波管)	C_{tot} η	D-006 D-007	V_R = 低的, 最好用 $f = 1$ MHz 规定偏置、电路、频率	X	X
C2b 分组 (适用时) 正向电压 反向电流	V_F I_R	D-001 D-002	I_F = 小电流 (恒定 (直流) 或脉冲*, 按规定) V_{R2} = 规定值 (最好取 $V_{R\max}$) 温度: 高温	(X) X	
C2c 分组 反向重复峰值功率和 (或) 反向不重复峰值功率 反向重复峰值能量和 (或) 反向不重复峰值能量 (仅用于可控雪崩二极管)	$P_{RRM/RSM}^{**}$ $W_{RRM/RSM}^{**}$	D-011 D-010	必须根据选择的特性来规定	X	X
C2d 分组 最大扭矩	R_{th}	G-002	按规定	(X)	
C3 分组 拉力 (D) 和 (或) 转矩		GB 4937—85 2.1.1 2.1.4	[对于特殊外形, 例如超小型器件可以不要求] 数 值 = 规 定 值	无损坏或规定值	

* 优选的脉冲条件: $t_p = 300\mu s$, $\delta \sim 2\%$ 。

** 测量方法: 见附录 A。

C组——周期(续)

检验或试验	符号	引用标准	条 件		检验要求 极 限
			最小值	最大值	
C4分组 耐焊接触热(D) 最后测试: 反向电流 正向电压	I_{R1} V_{F1}	GB 4937—85 2.2.2	按规定 按A2分组 按A2分组	USL USL USL	
击穿电压(仅用于可控雪崩二极管)	$V_{(BR)}$		按A2分组	L.S.L.	USL
C5分组 不适用					
C6分组 冲击或振动 继之以: 恒定加速度 最后测试: 反向电流 反向电压 击穿电压(仅用于可控雪崩二极管)	I_{R1} V_{F1} $V_{(BR)}$	GB 4937—85 2.4或2.3 GB 4937—85 2.5	[对于塑料封装(非空腔)器件不适用] 按A2分组 按A2分组 按A2分组	USL USL USL	L.S.L.
C7分组 如果适用: 静态触热(D) 或 交变触热(D) Db		GB 4937—85 3.5 GB 2423.4—81	按规定 按规定		

GB 6588—86

C组——周期(续)

检验或试验	符号	引用标准	条 件		检验要求 极限
			除非另有规定, T_{cm} 或 $T_{case} = 25^{\circ}\text{C}$	(见 GB 4936.1 的第 4 章)	
(仅用干电容整流器件) 最后测试: 反向电流 正向电压 击穿电压(仅用于可熔 雪崩二极管)	I_{R1} V_{F1} $V_{(BR)}$			按规定	最大值
C8分组 电耐久性 最后测试: 反向电流 正向电压 击穿电压(仅用于可熔 雪崩二极管)		GB 4938—85	高温反偏或工作寿命, 至少 1000h	按 A 2 分组 按 A 2 分组 按 A 2 分组	2 USL 1.1 USL 0.95 LSL 1.05 USL
C9分组 高温贮存(D) 最后测试: 反向电流 正向电压 击穿电压(仅用于可熔 雪崩二极管)		GB 4937—85 3.2	在最高贮存温度下至少 1000h	按 A 2 分组 按 A 2 分组 按 A 2 分组	2 USL 1.1 USL 0.95 LSL 1.05 USL
CRR1分组			(3, C5, C6, C9) 的属性资料和 C8 测试前的 I_{R1} 和 I_{F1} , 以及 $V_{(BR)}$ 的测试数据(即于存储极限)		

9 D组——鉴定批准试验

[当要求时，本试验应在详细规范中规定（只供鉴定批准用）。]

10 附加资料（不做检验用）

[只要规范和器件使用需要，就应给出附加资料，例如：

- 与极限值有关的温度降额曲线；
- 测量电路或补充方法的完整说明；
- 详细的外形图。]

附录 A
雪崩和可控雪崩整流二极管反向峰值
功率和反向瞬态能量的测试方法
(参考件)

A.1 反向峰值功率(重复或不重复) P_{RRM} 或 P_{RSM} 的测试

目的：在规定条件下，检验可控雪崩整流二极管和雪崩整流二极管的反向峰值功率的额定值。

推荐二种方法：方法A采用矩形脉冲法和方法B采用正弦波法，对于大功率器件，用这两种方法较为简单和较为容易。

A.1.1 方法A：矩形脉冲法

A.1.1.1 电路图

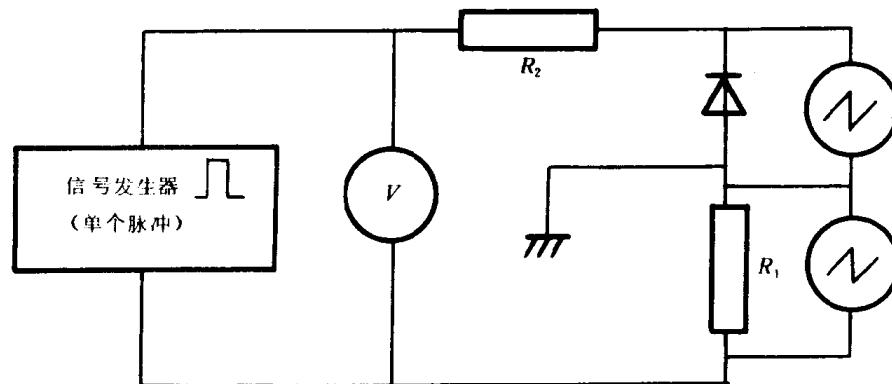


图 A1

A.1.1.2 电路说明和要求

电阻 R_1 是一个分流器。

脉冲电流应按图 A 2 规定，由并联在 R_1 上的示波器来监测。

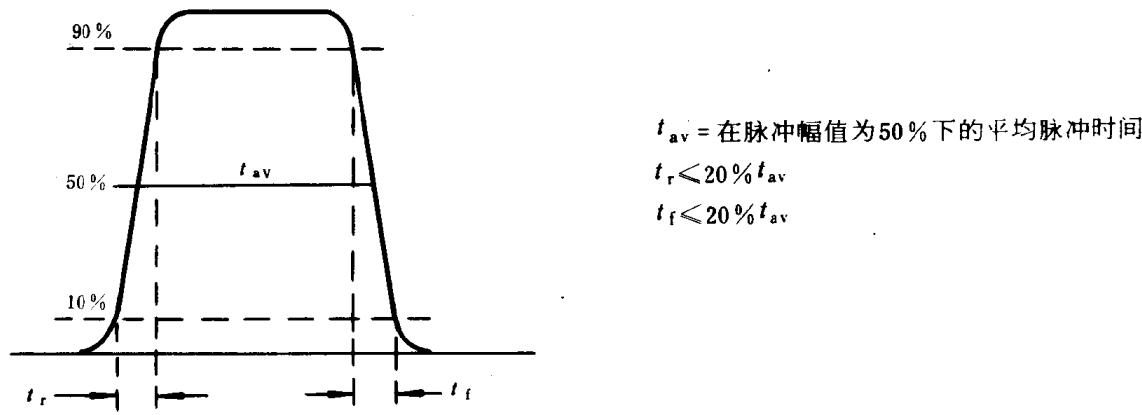


图 A2